

# 霍尔效应测试 霍尔系数测试 测试温度2-400k

产品名称	霍尔效应测试 霍尔系数测试 测试温度2-400k
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

霍尔效应测，主要用于研究半导体材料/光电材料的电学特性，可以测量材料在不同温度、磁场下的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数及载流子类型。而这些参数是了解半导体材料电学特性必须预先掌控的，

因此霍尔效应测是理解和研究半导体器件和半导体材料电学特性必备的工具。

可测试材料

- 1.半导体材料：SiGe，SiC，InAs，InGaAs，InP，AlGaAs，HgCdTe和铁氧体材料等等。
- 2.低阻抗材料：金属、透明氧化物、弱磁性半导体材料、TMR材料等。
- 3.高阻抗材料：半绝缘的GaAs, GaN, CdTe等。